

X線回折-示差走査熱量同時測定装置

理学電機株式会社製

設置場所： バイオナノテクノロジーセンター（片柳研究所棟 6階）



X線を照射することにより様々な物質の構造を解析し、同時に相転移も測定できる装置です。この装置は汎用性が高く、様々な物質の化学的、物理的な性質を測定するのに使われます。

装置の特長

- X線回折との同時測定により、DSCだけでは判断し難い昇降温時の結晶変化情報を容易に取得可能
- XRD、DSCが分離し、単独測定も可能
- 多層膜ミラーによる単色光輝度入射ビームによりP/B比の高いデータ獲得

対象物

- 有機化合物・医薬品・高分子・無機化合物・セラミック・電子材料の評価に威力を発揮